



PHOENIX V|tome|x M Neo

La metrología y el análisis 3D de alta calidad con TC industrial empiezan aquí

El escáner industrial de doble tubo para micro/nano TC más flexible del mundo

Descubra el futuro de los ensayos no destructivos con el nuevo Phoenix V|tome|x M Neo.

Nuestra emblemática solución de tomografía computarizada establece un nuevo estándar en flexibilidad, velocidad y calidad de detección, lo que la convierte en la elección definitiva para una amplia gama de aplicaciones en diversos sectores.

Distancia enfoque-detector variable para mejorar los resultados de exploración con un menor tiempo de exploración

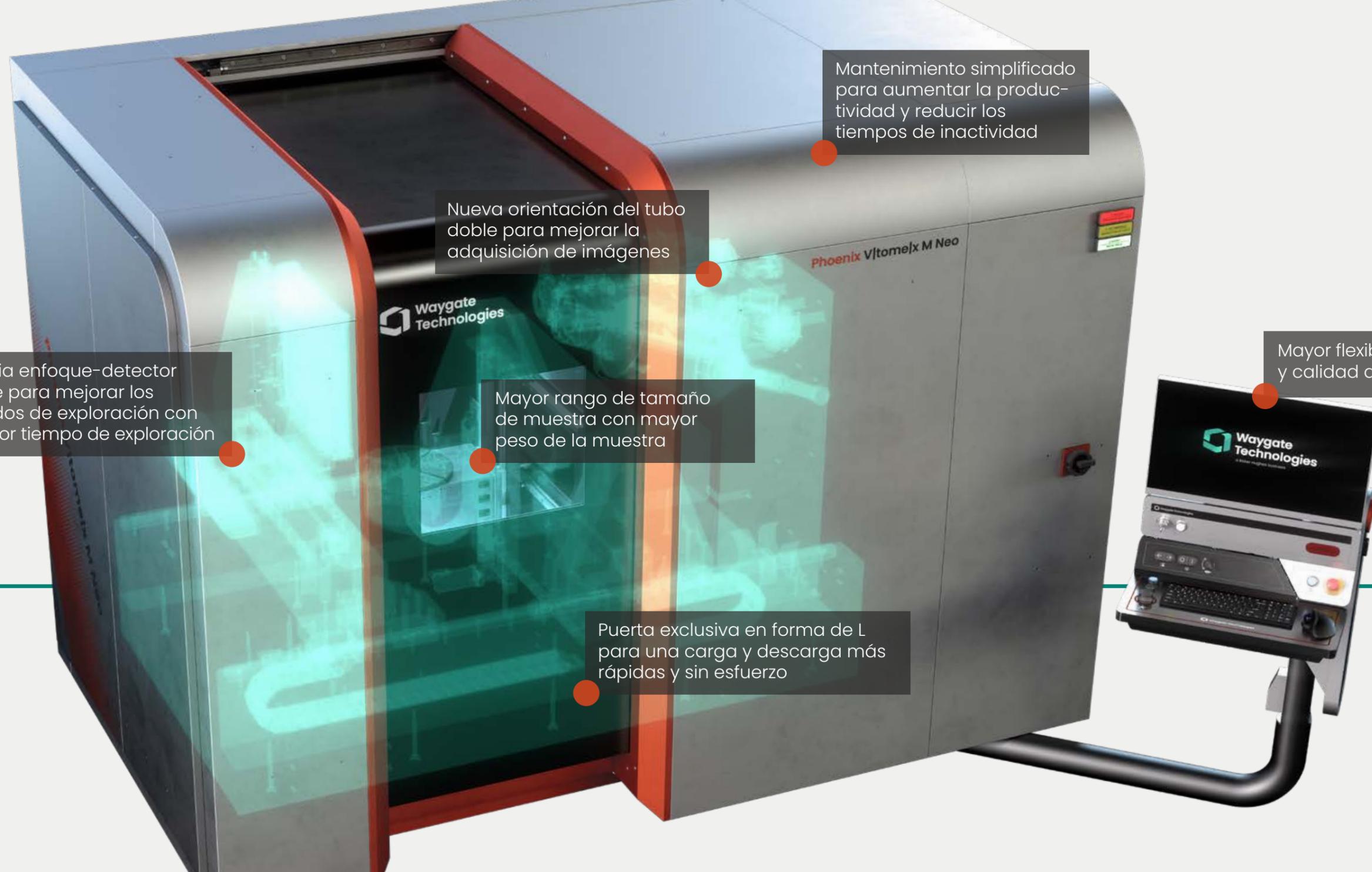
Nueva orientación del tubo doble para mejorar la adquisición de imágenes

Mantenimiento simplificado para aumentar la productividad y reducir los tiempos de inactividad

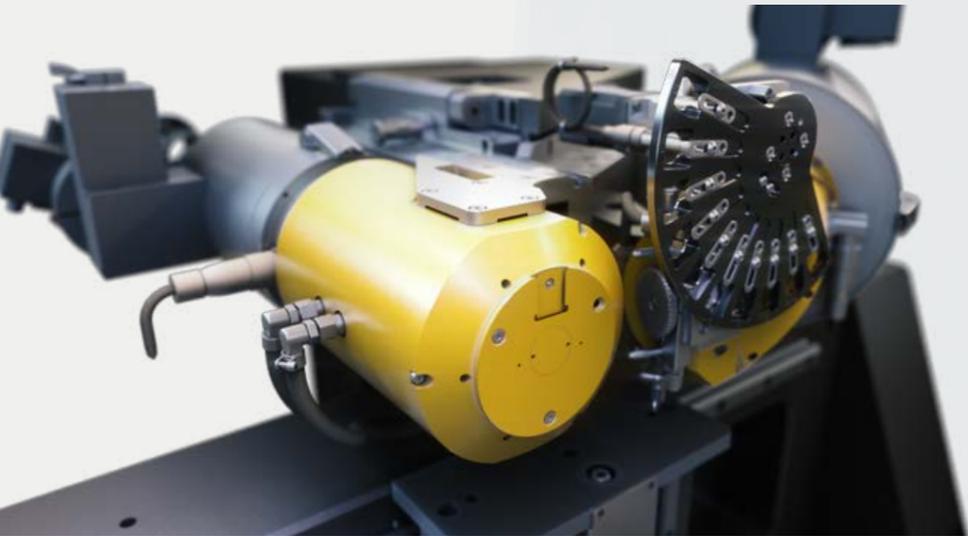
Mayor rango de tamaño de muestra con mayor peso de la muestra

Puerta exclusiva en forma de L para una carga y descarga más rápidas y sin esfuerzo

Mayor flexibilidad, velocidad y calidad de detección

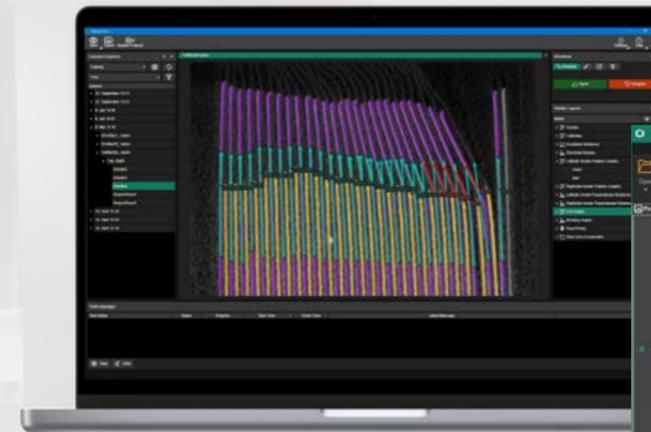


CARACTERÍSTICAS

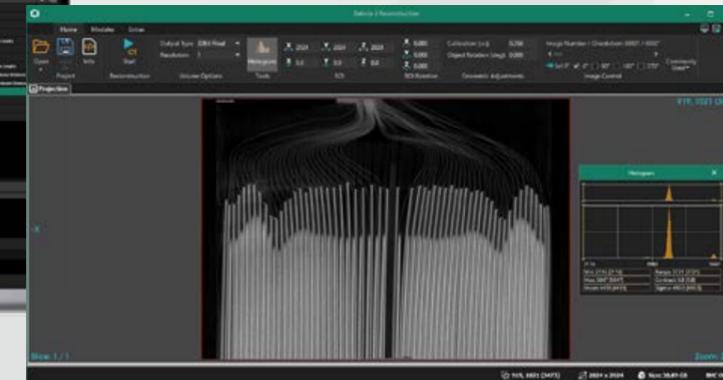


FUNCIONES AVANZADAS PARA IMÁGENES Y ANÁLISIS SUPERIORES

- Tubos de microenfoque y nanoenfoque de alto rendimiento
- La configuración de doble tubo con orientación horizontal mejora la adquisición de imágenes
- Detectores exclusivos Dynamic 41
- Tecnología High-flux|target que permite una exploración más rápida



Xlapprover



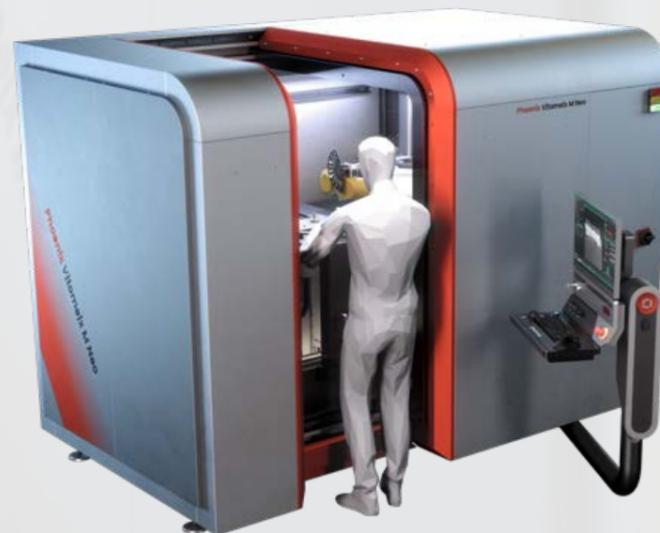
Datos|x

AUTOMATIZACIÓN BASADA EN LA EFICIENCIA

- Flujos de trabajo con reconocimiento automático de defectos (ADR) mediante el software Xlapprover
- Equipado con el último software Datos|x, que proporciona un control total de la adquisición de datos y una reconstrucción de datos aún más rápida

DISEÑO ACCESIBLE

- Dos puertas correderas grandes facilitan el manejo
- Carga flexible mediante grúa interna o externa
- Panel de control de gran versatilidad

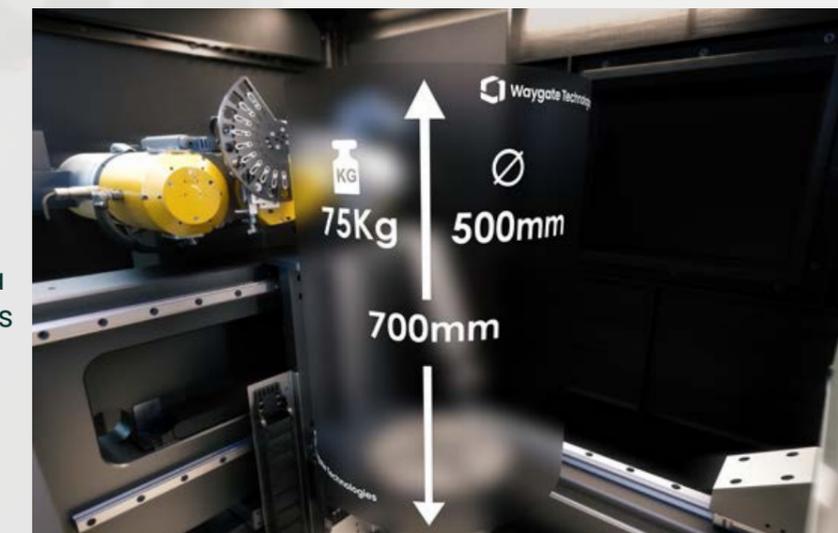


UNA SOLUCIÓN CON GRAN CAPACIDAD DE USO

- Puerta de mantenimiento de fácil acceso
- Manipulador rediseñado para ofrecer una mayor eficacia

ÁREA DE ESCANEADO AMPLIADA PARA PIEZAS MÁS GRANDES Y PESADAS

- Área de escaneo ampliada apta para inspeccionar piezas pequeñas y grandes
- Distancia variable del detector de enfoque



APLICACIONES

Hecho para dar respuesta a los retos de su sector

El Phoenix V|tome|x M Neo es un sistema flexible apto para una amplia gama de aplicaciones de metrología 3D, investigación y evaluación en entornos de laboratorio.

Además, sus funciones de automatización hacen que resulte idóneo para realizar pruebas precisas en entorno de producción, proporcionando resultados fiables para aplicaciones industriales.

- Ideal para evaluar microestructuras y ensamblajes complejos, examinar uniones soldadas o inspeccionar desde placas de circuitos pequeñas a grandes
- Optimización de los procesos de fabricación en la industria electrónica

- Destaca en la evaluación de componentes críticos como las láminas aerodinámicas y las piezas de fabricación aditiva utilizadas para recambios y mantenimiento, así como la tecnología punta de fibra de carbono
- Funciones avanzadas para evaluar componentes electrónicos complejos fabricados a medida para satélites

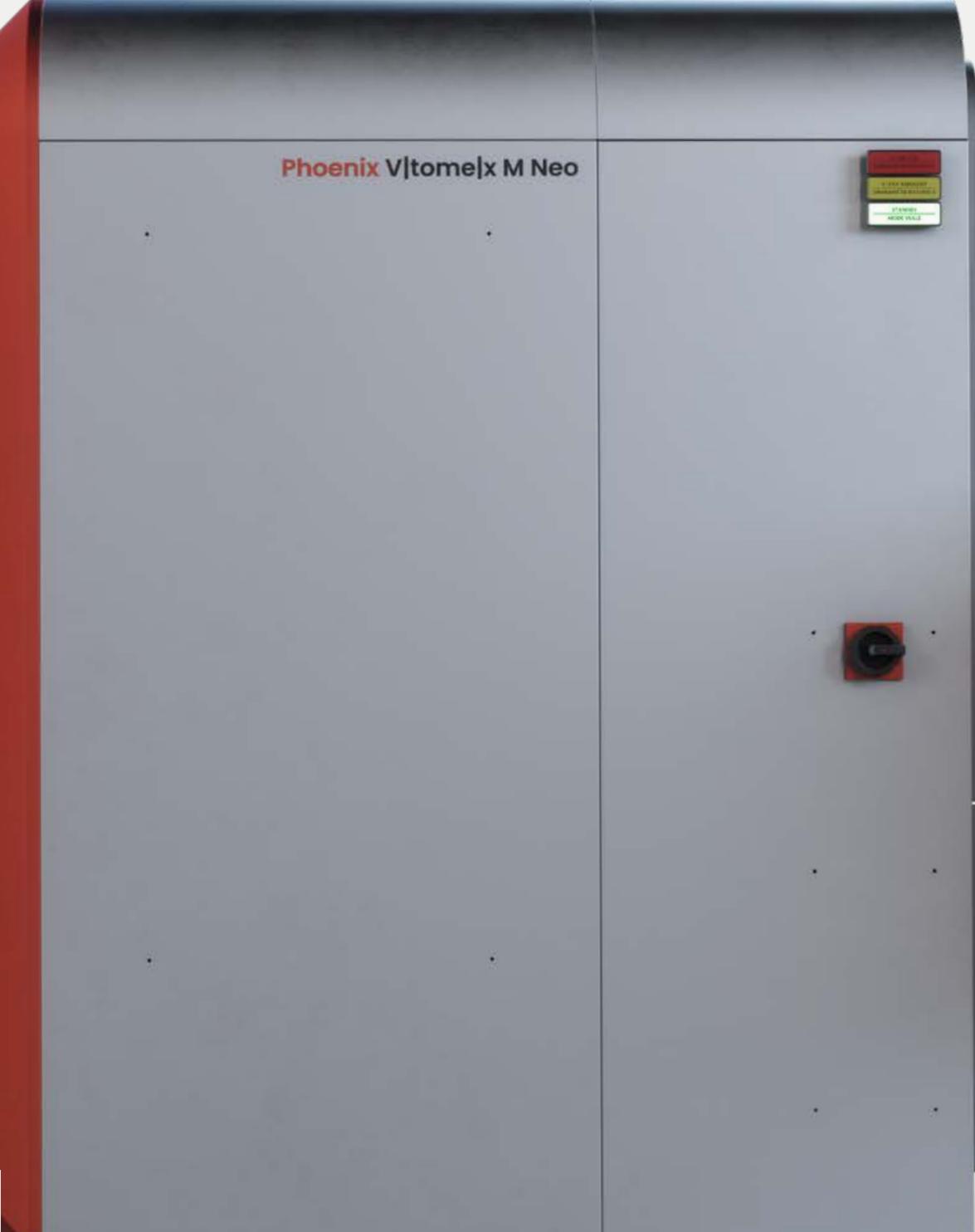
- Mediciones precisas de ánodo y cátodo para celdas cilíndricas, prismáticas y tipo pouch
- Análisis de fallos en las distintas configuraciones de celdas para baterías

UN LARGO LEGADO

Construir siguiendo la tradición

El Phoenix V|tome|x M Neo es un sistema de TC industrial de última generación basado en el éxito de la plataforma Phoenix V|tome|x, ampliamente utilizada y con más de mil instalaciones en todo el mundo. Ofrece avances notables, como resultados

de imagen mejorados, una área de exploración ampliada para muestras más grandes y pesadas, distancia variable del detector de enfoque y un nuevo diseño de cabina para mejorar la flexibilidad y la accesibilidad.



Puerta exclusiva en forma de L para cargar muestras pesadas y de gran tamaño

50 KG V|tome|x M

75 KG V|tome|x M Neo

Mayor peso máximo de la muestra

420 x 400mm

V|tome|x M

500 x 700mm

V|tome|x M Neo

Envolvente de escaneo aumentada

Tipo de tubo de rayos X	Tubo de rayos X direccional abierto de microfocalización de alta potencia, circuito cerrado de agua de refrigeración. Tubo de rayos X de nanoenfoque de alta potencia de transmisión abierta adicional opcional.
Tensión/potencia máx.	300 kV/500 W. Como alternativa, disponible con tubo de rayos X de microfoco de 240 kV/320 W Opción de tubo doble para nanoCT®: tubo de nanoenfoque adicional de alta potencia de 180 kV/20 W con ventana Diamond, unidad de rotación de alta precisión, cambio de tubo sencillo tan solo pulsando un botón.
Aumento geométrico (3D)	De 1,29 x a 100 x; hasta 225 x con tubo de rayos X de nanoenfoque
Detectabilidad de detalles	Hasta < 1 µm (tubo de microenfoque); opcionalmente hasta 0,2 µm (tubo de rayos X de nanoenfoque)
Tamaño de vóxel mín.	Hasta 2 µm (microenfoque); opcionalmente 1 µm con Dynamic 4I 100; opcionalmente hasta < 0,5 µm (nanoenfoque + Dynamic 4I 100)
Tipo de detector (todo de conformidad con la norma ASTM E2597 de EE.UU.)	Detector de área grande Dynamic 4I 200 estabilizado por temperatura con imagen y resultados de calidad superior, 410 x 410 mm (16" x 16"), tamaño de píxel de 200 µm, 2036 x 2036 píxeles (4 MP), rango dinámico muy alto > 10000:1 Detector Dynamic 4I 100 opcional de 410 x 410 mm (16" x 16"), tamaño de píxel de 100 µm, 4048 x 4048 píxeles (16 MP) para duplicar la resolución de la TC
Manipulation	Manipulador de 6 ejes de precisión basado en granito
Distancia enfoque-detector variable	Opcionalmente 310 mm – 900 mm (12,2"–35,4")
Diámetro máx. de la muestra x altura	310 mm x 700 mm (12,2" x 27,5") de altura; hasta 500 mm (19,7") de diámetro cuando se utiliza un escáner offset
Peso máx. de la muestra	75 kg (165 lbs.), TC de alta precisión
Distancia máxima del objeto de enfoque	700 mm (27,55") aplicada para el tubo de microenfoque
Dimensiones del sistema An x Al x P	Aprox. 2911 mm x 2177 mm x 1710 mm (114,6" x 85,7" x 67,3")
Peso del sistema	Aprox. 9500 kg (20 940 lbs.)
Estabilización de la temperatura	Refrigeración activa del tubo de rayos X armario de temperatura controlada detector de temperatura estabilizado
Paquete opcional de software patentado Scatter correct hard-/ (también opción de actualización)	Calidad de TC como la TC de haz en abanico 2D con artefactos de radiación de dispersión minimizados. Diámetro máximo de escaneado: 290 mm, hasta 450 mm si se utiliza un escáner offset.
High-flux target opcional	Tomografías 2 veces más rápidas o resolución duplicada; potencia de inspección por rayos X de hasta 100 W
Helix CT y Offset CT opcionales	Trayectorias de escaneado avanzadas para mejorar el volumen de escaneado y la calidad de los datos: Helix CT para escanear piezas largas con menos artefactos y mejor calidad, Offset CT para escanear piezas más grandes o del mismo tamaño con mayor resolución.
Click&measure CT opcional	Incluido
Software	Software Phoenix Datos x para adquisición y reconstrucción de tomografías computarizadas 3D. Existen diferentes paquetes de software de evaluación 3D para metrología 3D, análisis de fallos o estructuras bajo petición.
Protección radiológica	Armario de seguridad radiológica para la instalación de una protección total sin homologación de conformidad con las leyes StrSchG/StrSchV alemanas. Cumple la norma francesa NFC 74 100 y la norma estadounidense 21 CFR Subcapítulo J. Para su uso pueden ser necesarias otras licencias oficiales.

Póngase en contacto con nosotros para comentarnos sus necesidades de control en [waygate-tech.com](https://www.waygate-tech.com)